

Thema

Charakterisierung der Einflüsse der Nahfeldsonden auf das DUT

Fragestellung

Wie beeinflusst die Nahfeldsonde das Device-Under-Test?

Idee

Charakterisierung des Einflusses

Aufgaben

- Überprüfung der Sondenmodelle
- Modellierung eines einfachen DUTs
- Charakterisierung der Einflüsse der Sonde auf das DUT (Feldverzerrung, Fehlfunktionen, ...)
- Erstellung eines Berichtes
- Fachvortrag zur Präsentation der Ergebnisse

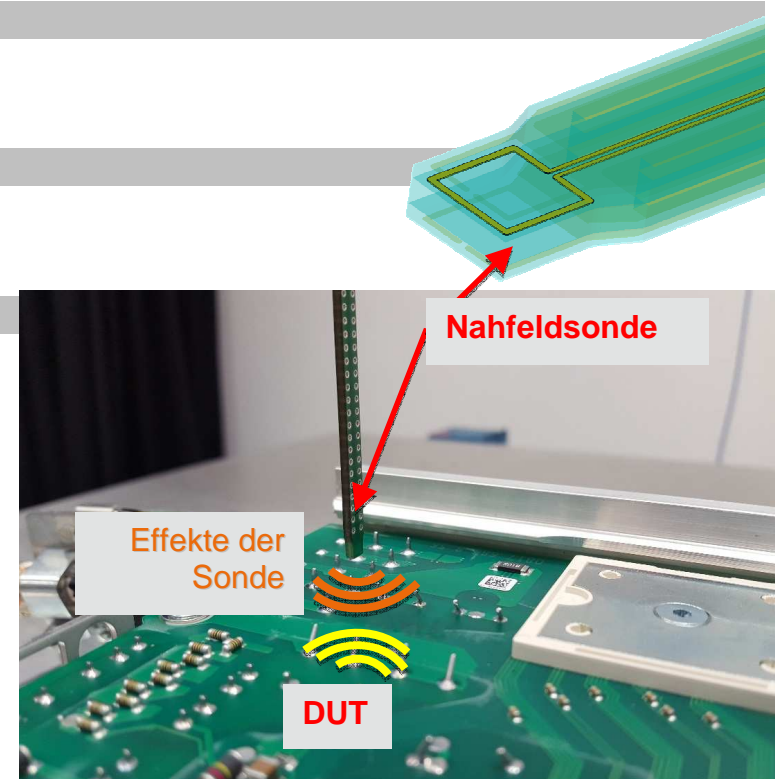


Bild: Fraunhofer ENAS

Ansprechpartner

Christian Hangmann
Abteilung: ASE des Fraunhofer ENAS
☎ 05251 / 60-5634
✉ hangmann@enas-pb.fraunhofer.de

Dr. Denis Sievers
Fachgebiet TET
☎ 05251 / 60- 3010
✉ sievers@tet.upb.de